

Product Model: TipCheck

El problema

En caso de estudio de una muestra con AFM es difícil de determinar si la imagen de la superficie es fiel o falsa debido a una posible rotura o desgaste de la punta de la sonda.

Las puntas desgastadas o rotas cambian dramáticamente los resultados de las medidas de la superficie lisa y la estructura de la muestra, lo que hace los resultados incorrectos. Para estar seguro que la punta de la sonda está en buen estado, las puntas usadas deben cambiarse o verificarse regularmente con Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) pero los dos métodos cuestan mucho.

La solución

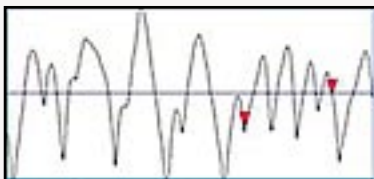
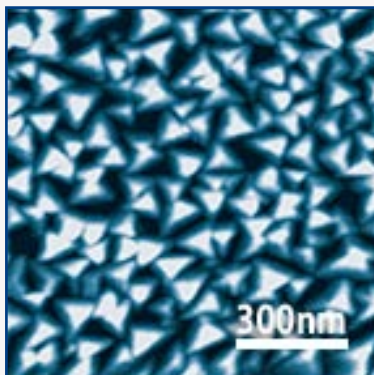
BudgetSensors presenta **Tipcheck** – muestra de Microscopía de Barrido por sondas (SPM) para verificar de manera fácil el estado de las puntas de AFM. La diferencia entre las diferentes puntas está evidente incluso en caso de barrido de sólo una línea de la muestra.

Por esta razón **Tipcheck** es una manera fácil y rápida de comparar y categorizar las diferentes puntas de las sondas según su forma y agudeza. Pueden verificar de manera fácil si sus puntas siguen en buen estado, empiezan a desgastarse o ya están totalmente desgastadas o rotas, sin la necesidad de barrer toda la imagen o hacer una verificación con SEM.

Además, esta muestra funciona con los productos de software de Calificación automática y caracterización de las puntas disponibles en el mercado.

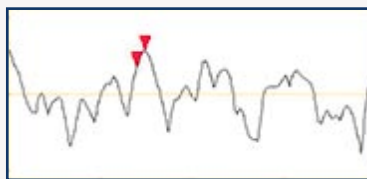
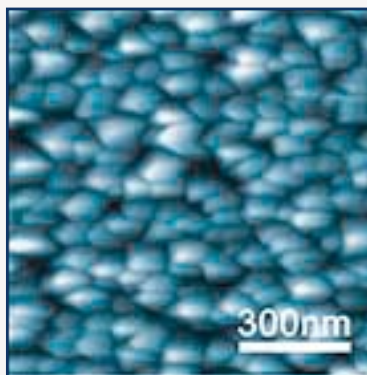
Estos esquemas presentan la comparación entre las diferentes puntas de sondas utilizadas para visualizar la muestra **Tipcheck**. La superficie barrida es de dimensiones 1 x 1 μm para cada una de las imágenes. La escala de altura es de unos 100 nm. Bajo las imágenes topográficas se puede ver el esquema representativo de la sección transversal correspondiente a cada imagen.

a) punta buena



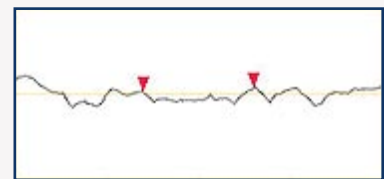
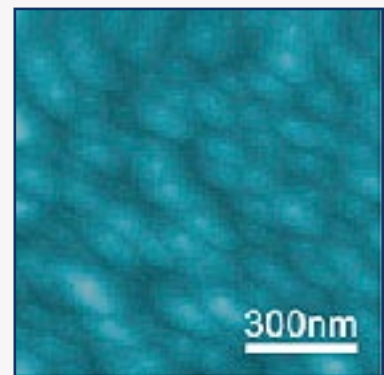
Ra=19.8nm

b) punta usada



Ra=10.7nm

c) punta desgastada



Ra=3.5nm

La muestra **TipCheck** de BudgetSensors está compuesta por una capa muy fina y resistente a desgaste sobre un chip de silicio. Esta capa tiene una nanoestructura granulosa con puntas agudas ideales para reproducción de la imagen por la punta de la sonda de AFM.

La dimensión de la matriz del **TipCheck** es de 5x5 mm. Se suministra pegada a un disco metálico para poder colocarla en su dispositivo de AFM.

Código de pedido

TipCheck

Precio:

\$180